

к ГОСТ 859-2001 Медь. Марки

Таблицу 2 заменить новой:

Т а б л и ц а 2 — Химический состав литой и деформированной меди

Обозна- чение марки	Массовая доля элементов									
	Медь, не менее	Медь+ серебро, не менее	Висмут	Железо	Никель	Цинк	Свинец	Сурьма	Примесей, не более	
M006	99,99	—	0,0005	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
M06	—	99,97	0,001	0,004	0,002	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002
M16	—	99,95	0,001	0,004	0,002	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002
M00	99,96	—	0,0005	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
M0	—	99,93	0,0005	0,004	0,002	0,003	0,001	0,002	0,002	0,002
M1	—	99,90	0,001	0,005	0,002	0,004	0,002	0,002	0,002	0,002
M1p	—	99,90	0,001	0,005	0,002	0,005	0,002	0,002	0,002	0,002
M1ф	—	99,90	0,001	0,005	0,002	0,005	0,002	0,002	0,002	0,002
M2p	—	99,70	0,002	0,05	0,2	—	0,05	0,005	0,005	0,05
M3p	—	99,50	0,003	0,05	0,2	—	0,05	0,05	0,05	0,05
M2	—	99,70	0,002	0,05	0,2	—	0,05	0,005	0,005	0,05
M3	—	99,50	0,003	0,05	0,2	—	0,05	0,05	0,05	0,05

П р и м е ч а н и я

- 1 В меди марок M006 и M00 массовая доля селена не должна превышать
- 2 По согласованию (контракту) изготовителя с потребителем допускается
- 3 В обозначение меди марок M1 и M1p, предназначенной для электротех-
нологическию включают букву Е.

В процентах

Способ получения (спиральной)	В процентах					
	Малышак	Свинец	Сера	Кислород	Фосфор	Серебро
Переплавка катодов в восста- новительной или в инертной ат- мосфере или в ва- кууме	0,001	0,001	0,001	0,001	0,0003	0,002
	0,002	0,003	0,003	0,001	0,002	—
	0,002	0,004	0,004	0,003	0,002	—
Переплавка катодов	0,001	0,001	0,002	0,03	0,0005	0,002
	0,001	0,003	0,003	0,04	—	—
	0,002	0,005	0,004	0,05	—	—
Переплавка катодов и лома меди с раскисле- нием фосфором	0,002	0,005	0,005	0,01	0,002—0,012	—
	0,002	0,005	0,005	—	0,012—0,04	—
	0,01	0,01	0,01	0,01	0,005—0,06	—
Относие ра- финирование и переплавка отхо- дов и лома меди	0,01	0,01	0,01	0,07	—	—
	0,01	0,05	0,01	0,08	—	—
	0,01	0,05	0,01	0,08	—	—

0,0005 %, теллура — 0,0005 %.
Изготовление меди марок M06 с массовой долей кислорода не более 0,002 %,
химической промышленности и подлежащей испытаниям на электропроводность,

№ 1 2002 г.)

(ИУС